



中華民國專利證書

發明第 I519791 號

發明名稱：用於一光學輔助原子力顯微鏡系統的掃描樣本的方法及其裝置

專利權人：國立臺灣大學

發明人：傅立成、吳俊緯、陳志烈、林奕廷、羅宇廷

專利權期間：自2016年2月1日至2033年11月24日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

王美花

中華民國 105 年 2 月 1 日

